



【粒子計測ソフトウェア】

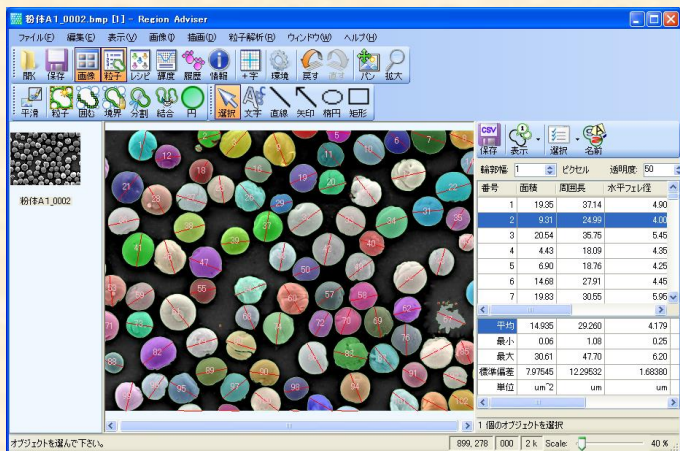
対応機種：

日本電子社製走査電子顕微鏡 FE-SEM (JSM-7000 シリーズ)

日本電子社製走査電子顕微鏡 W-SEM (MP シリーズ)

TEMography.com
By SYSTEM IN FRONTIER INC.

『粒子計測』



➤ 計測項目

- ◇ 円相当径
- ◇ 面積
- ◇ 真円度
- ◇ 水平/垂直フェレ径
- ◇ 輝度 (最小/最大/平均/標準偏差)
- ◇ 周囲長
- ◇ 最大長/幅
- ◇ 重心
- ◇ ...

計測結果をCSV形式のファイルに保存する事が出来ます。また、複数枚分の結果を、1つのCSVにまとめて保存することも出来ます。

《計測結果》

計測結果を一覧表で確認できます。表示項目をカスタマイズする事も可能です。

番号	面積	最大長	水平フェレ径	垂直フェレ径
1	556.981	899	800	885
2	490.511	859	855	790
3	368.996	802	740	685
4	364.971	856	785	655
5	361.697	741	715	710
6	353.197	744	645	745
平均	66,713.6	301.6	272.9	263.2
最小	6.474	114	95	55
最大	556.981	899	855	885
標準偏差	80,309.5...	159.521	146.305	146.430
単位	nm ²	nm	nm	nm

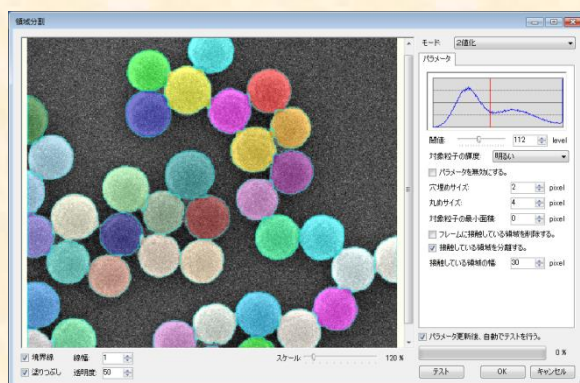
《自動倍率構成》

- 撮影倍率より自動的に倍率を校正します。
- 撮影条件(倍率/WD/加速電圧/機種)毎に倍率校正の係数を設定する事が可能です。

装置名	倍率	加速電圧	作動距離	係数X	係数Y	更新日付
JSM-6610	20000	15	10	1.000000	1.000000	2009/01/07 14:1...

《粒子検出》

自動で粒子を検出する事が出来ます。



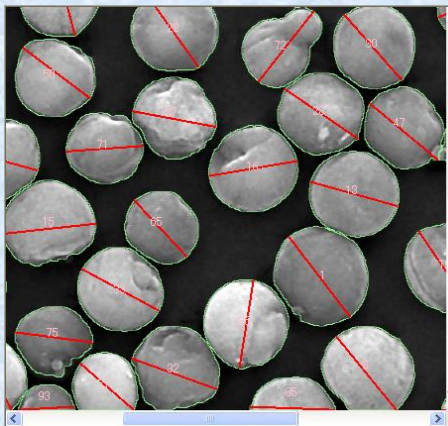
《統計結果》

計測項目毎の統計結果を一覧表で確認できます。統計目をカスタマイズする事も可能です。

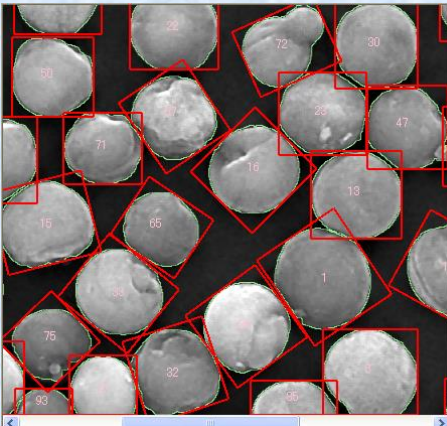
ファイル名	500未満	1000未満	1000以上	フレーム接触
粉体A1_0001	18	53	647	105.00
粉体A1_0002	3	12	183	55.00
粉体A2_0003	8	4	324	52.00
粉体A2_0004	1	2	96	33.00
粉体B_0001	103	293	349	92.00
粉体B_0002	30	74	247	50.00
総数	163	428	1,846	387.00
平均	27	71	308	64.50
最小	1	2	96	33.00
最大	103	293	647	105.00
標準偏差	35	98	174	25.32

《レタリング》

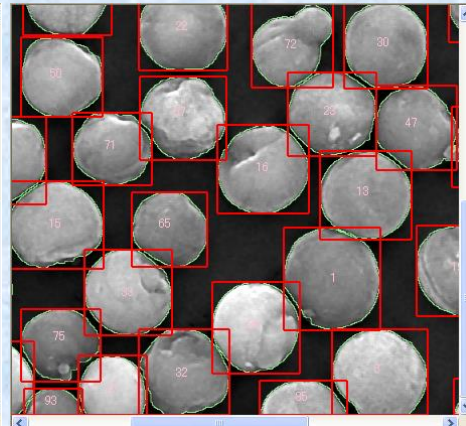
【最大長】



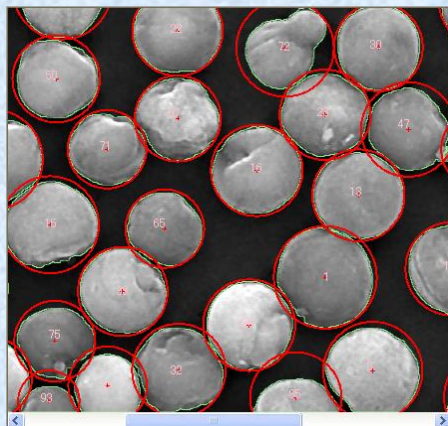
【矩形】



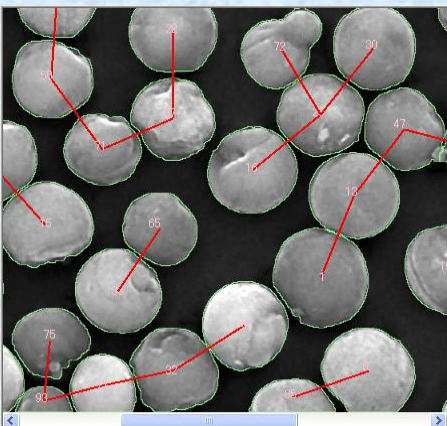
【フェレ系】



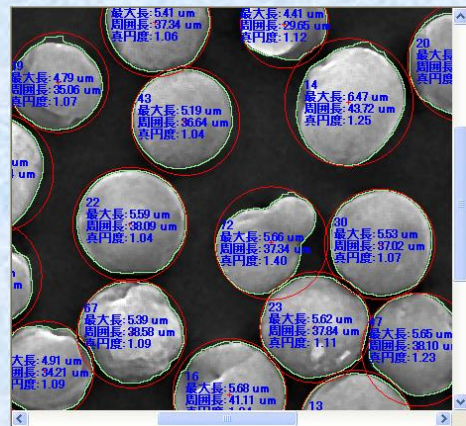
【円】



【近隣粒子】

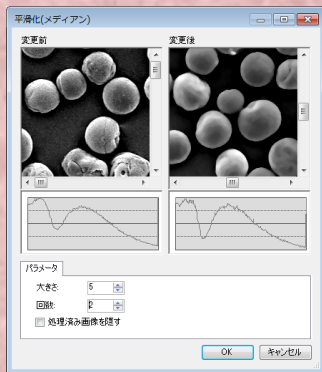
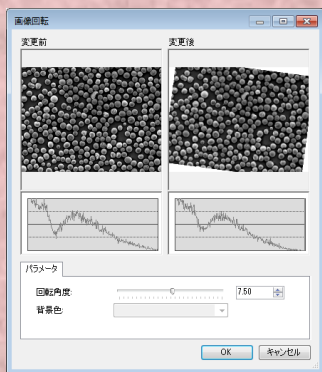


【計測結果】

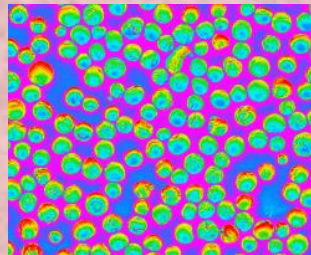


《画像編集》

「階調補正」、「回転補正」等の画像編集をプレビューにて確認する事が出来ます。

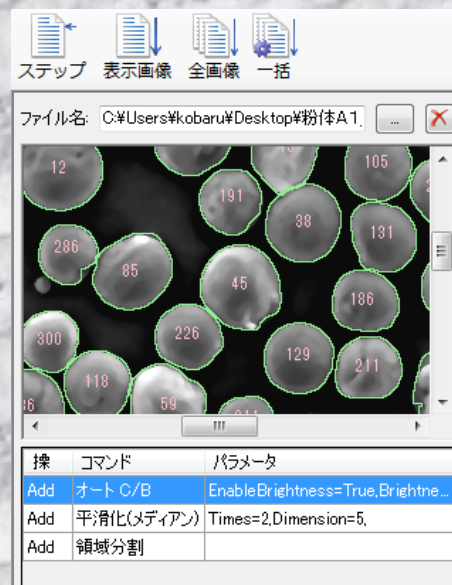


グレースケール像を「擬似カラー」で表示する事によって低い輝度でしか現れなかった特徴等を効率よく見つける事が可能になります。



《レシピ》

いつも同じような操作手順で粒子解析を行っている場合、レシピ機能を使う事によって複数の画像ファイルを一括で粒子解析を行う事が出来ます。



このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更になる事があります。

株式会社システムインフロンティア

所在地 〒190-0012 東京都立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル 4F
 電話番号 042-526-4364
 FAX 番号 042-526-4370
 URL http://www.sifi.co.jp

TEMography.com
 By SYSTEM IN FRONTIER INC.